

PRESSEMITTEILUNG

Das neue JPK NanoWizard ULTRA Speed AFM System für Fast-Scanning & Super-Resolution Anwendungen

Berlin, 11. Dezember 2013: JPK Instruments, ein weltweit führender Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten für den "Life Sciences"- und "Soft Matter"-Bereich, stellt die nächste Generation des NanoWizard® Rasterkraftmikroskops (AFM) für Fast-Scanning- und Super-Resolution Anwendungen in Kombination mit inverser Lichtmikroskopie vor.

JPK Instruments hat die Leistungsgrenzen in der Rasterkraftmikroskopie weiter verschoben und ein neues System auf den Markt gebracht, mit dem Fast-Scanning- und Super-Resolution-Messungen vorgenommen werden können, das NanoWizard® ULTRA Speed AFM.

Mit dem schnell-scannenden NanoWizard® ULTRA Speed AFM können Änderungen der Probe in Echtzeit verfolgt werden, sowohl in Luft als auch in Flüssigkeiten. Aufnahmen mit Geschwindigkeiten größer 100Hz Zeilenrate sowie atomarer Auflösung im Closed-Loop Modus werden ermöglicht durch ein extrem rauscharmes Scanner-, Sensor- und Detektionssystem. Mit JPK's einzigartigem QI™ (Quantitative Imaging) Modus können Materialeigenschaften quantitativ erfasst werden.

Wie die vorangegangenen NanoWizard® Systeme, kann das ULTRA Speed AFM dank des Tip-Scanning Designs und des DirectOverlay™ Modus für hochpräzise korrelative Mikroskopie vollständig in ein inverses Lichtmikroskop integriert werden. Mit dem JPK RampDesigner™ und dem ExperimentPlanner™ bietet das System zudem umfassende Möglichkeiten für Kraftmessungen an Einzelmolekülen oder lebenden Zellen. Das System ist vollständig kompatibel mit der einzigartigen Vielfalt an Abbildungsmodi und an Zubehör, das JPK vor allem für die Kontrolle der Probenbedingungen bereithält.

Torsten Jähne, Firmengründer und Entwicklungschef, über das neue NanoWizard® ULTRA Speed AFM: "Wieder einmal haben wir einen neuen Standard in Bezug auf Auflösung und Messgeschwindigkeit gesetzt. Es ist uns gelungen ein absolut rauscharmes Lichtzeigersystem zu entwickeln, das zusammen mit unserer neuesten schnellen Breitband-Elektronik selbst an schwierigsten Proben Messungen mit präziser Kraftkontrolle ermöglicht. Perfekt für Wissenschaftler, die biologische oder andere sog. „weiche“ Systeme untersuchen. Es ist das beste schnellmessende und hochauflösende Multifunktionsgerät, das heutzutage auf einem inversen Lichtmikroskop erhältlich ist."

JPK Instruments entwickelt, konstruiert und fertigt Instrumente in Deutschland zu weltweit anerkannten Standards der deutschen Feinmechanik, Qualität und Funktionalität. Für weitere Einzelheiten über das NanoWizard® ULTRA Speed AFM und weitere Produkte besuchen Sie uns auf der JPK Webseite www.jpk.com, YouTube, Facebook oder LinkedIn.

Anlage:



Das neue JPK NanoWizard® ULTRA Speed AFM auf einem Zeiss Axiovert Lichtmikroskop.

Kontakt:

Dr. Gabriela Bagordo
tel: + 49 30 5331 12070
fax: +49 30 5331 22555
bagordo@jpk.com

JPK Instruments AG
Bouchéstrasse 12
12435 Berlin
www.jpk.com

Über JPK Instruments AG

JPK Instruments AG ist ein weltweit führender Hersteller von Nanoanalytik-Instrumenten, insbesondere von rasterkraftmikroskopischen Systemen (AFM) und optischen Pinzetten (Optical Tweezers), mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Soft Matter Physik bis zur Nanooptik, von der Oberflächenchemie bis hin zur Zell- und Molekularbiologie. Als Experte in der Technologie der Rasterkraftmikroskopie hat JPK mit als erstes die bahnbrechenden Möglichkeiten der Nanotechnologie auf den Gebieten der Life Sciences und der Soft Matter erkannt. Durch Innovationsgeist, durch Spitzentechnologie und eine einzigartige Applikationsexpertise hat JPK die Nanotechnologie erfolgreich mit den Life Sciences zusammengeführt. JPK hat seinen Hauptsitz in Berlin sowie weitere Standorte in Dresden (Deutschland), Cambridge (UK), Singapur, Tokio (Japan) und Paris (Frankreich). Mit seinem globalen Vertriebsnetz und mehreren Support Centern betreut JPK die kontinuierlich wachsende Zahl von Anwendern mit ganzheitlichen Lösungen und erstklassigem Service direkt vor Ort.